PC

CLIPPEDIMAGE= JP411288995A

PAT-NO: JP411288995A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11288995 A

TITLE: TRANSFER SYSTEM AND PROCESSING DEVICE THEREOF

PUBN-DATE: October 19, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME HIROKI, TSUTOMU COUNTRY

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOKYO ELECTRON LTD

N/A

APPL-NO: JP10108577

APPL-DATE: April 4, 1998

INT-CL (IPC): H01L021/68;B65G049/04 ;C23C016/44 ;C23C016/50 ;G02F001/13

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transfer system and a processing device thereof, wherein the transfer system is equipped with a single arm which is capable of being securing of a transfer time comparable to that of a double arm, enhanced in space-saving properties, lessened in manufacturing cost, and improved in reliability.

SOLUTION: A transfer system 8 is equipped with an LCD substrate loading/unloading mechanism 9 provided to a mounting pad 7 located inside a processing chamber 2, where an LCD substrate 1 is subjected to a prescribed treatment under vacuum and a transfer mechanism 10 which transfers the LCD substrate 1, wherein the loading/unloading mechanism 9 is equipped with four first loading/unloading members 9A which are provided a mounting pad 7, movable in a vertical direction, and capable of loading/unloading the LCD substrate 1 before or after it has been subjected to a treatment and four second loading/unloading members 9B which are movable in a vertical direction and capable of loading/unloading the LCD substrate 1 before or after it is subjected to a treatment the members 9A, and the transfer mechanism 10 is equipped with a single arm 10B which raises or lowers in a vertical direction between the loading/unloading position of the first member 9A and the loading/unloading position of the second member 9B.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特關平11-288995

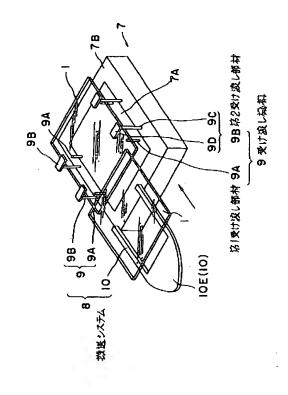
(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

(51) Int.Cl. ⁶		證別配号	FΙ		
HO1L	21/68		H 0 1 L 21/68	Α	
B65G	19/01		B 6 5 G 49/04 H		
C 2 3 C	16/44		C 2 3 C 16/44 F		
	16/50		16/50		
G 0 2 F	1/13	101	G 0 2 F 1/13	101	
			審查請求 未請	求 請求項の数4 FD (全 7 頁)	
(21)出願番号		特頭平10-108577		(71)出頭人 000219967	
			74.	エレクトロン株式会社	
(22) 出頭日		平成10年(1998) 4月4日	東京都港区赤坂5丁目3番6号		
			(72)発明者 広木	動	
			山梨	県韮崎市蔚井叮北下条2381番地の1	
			東京	エレクトロン山梨株式会社内	
			(74)代理人 弁理	土 小原 墢	

(57)【要約】

【課題】 ダブルアームタイプの搬送機構の場合には、 LCD用基板等の被処理体の搬送時間を短縮することができる反面、上下二段のアームと各アームを個別に駆動する駆動機構が必要であるため、搬送室のスペースが大きくなると共に搬送機構の駆動機構が複雑になってコスト高になり、しかも各アームの動作のタイミングを取ることが難しく、信頼性に劣る。

【解決手段】 本発明の搬送システムは、減圧下でLC D用基板1に所定の処理を施す処理室2内の載置台7に付設されたLCD用基板1の受け渡し機構9と、LCD 用基板1を搬送する搬送機構10とを備えた搬送システム8において、受け渡し機構9は、載置台7の上方で処理前後のLCD用基板1を受け渡す昇降可能な4箇所の第1受け渡し部材9Aと、これよりも高い位置で処理前後のLCD用基板1を受け渡す昇降可能な4箇所の第2受け渡し部材9Bとを有し、また、搬送機構10は、第1受け渡し部材9Aの受け渡し位置と第2受け渡し部材9Bの受け渡し位置との間で昇降するシングルアーム10Bを有することを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 減圧下で被処理体に所定の処理を施す処 理室内の載置台に付設された上記被処理体の受け渡し機 構と、この受け渡し機構まで上記被処理体を搬送して上 記被処理体を遺取りし且つ上記処理室に対して連通、遮 断可能に連結された搬送室内に配設された搬送機構とを 備えた搬送システムにおいて、上記受け渡し機構は、上 記載置台の上方で処理前後の被処理体を受け渡す昇降可 能な複数の第1受け渡し部材と、第1受け渡し部材より も高い位置で処理前後の被処理体を受け渡す昇降可能な 複数の第2受け渡し部材とを有し、また、上記搬送機構 は、少なくとも第1、第2受け渡し部材それぞれの受け 渡し位置間で昇降するシングルアームを有することを特 徴とする搬送システム。

【請求項2】 第2受け渡し部材は上記載置台の上記被 処理体の載置位置よりも外側に配置され且つ上記被処理 体の外側から内側へ張り出す正逆回転可能な支持部材を 有することを特徴とする請求項1に記載の搬送システ A.

【請求項3】 減圧下で載置台上に載置された被処理体 20 に所定の処理を施す処理室と、この処理室に対して連 通、遮断可能に連結された搬送室と、この搬送室と上記 処理室との間で処理前後の被処理体を遺取りする搬送シ ステムとを備え、且つ、上記搬送システムは、上記載置 台に付設された受け渡し機構と、上記搬送室内に配設さ れた搬送機構とを備えた処理装置において、上記受け渡 し機構は、上記載置台の上方で処理前後の被処理体を受 け渡す昇降可能な複数の第1受け渡し部材と、第1受け 渡し部材よりも高い位置で処理前後の被処理体を受け渡 す昇降可能な複数の第2受け渡し部材とを有し、また、 上記搬送機構は、少なくとも第1、第2受け渡し部材そ れぞれの受け渡し位置間で昇降するシングルアームを有 することを特徴とする処理装置。

【請求項4】 第2受け渡し部材は上記載置台の上記被 処理体の載置位置よりも外側に配置され且つ上記被処理 体の外側から内側へ張り出す正逆回転可能な支持部材を 有することを特徴とする請求項3に記載の処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示体用基板 40 (以下、「LCD用基板」と称す。)や半導体ウエハ等 の被処理体を処理する際に、処理前後の被処理体を搬送 する搬送システム及びこの搬送システムを備えた処理装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の処理装置としては、例え ば、マルチチャンバー処理装置が広く用いられている。 マルチチャンバー処理装置は、例えば、減圧下で被処理 休(例えば、LCD用基板)にそれぞれ同種または異種 の処理を施す複数(例えば、3室)の処理室と、これら 50 スト高になり、しかも各アームの動作のタイミングを取

の処理室に接続された搬送室と、この搬送室に処理室と 同様に接続されたロードロック室と、このロードロック 室と載置機構に配置されたキャリアとの間でLCD用基 板を遺取りする搬送機構とを備えている。

2

【0003】LCD用基板に所定の処理を施す場合に は、搬送機構の多関節型搬送アームを屈伸して載置機構 に配置されたキャリアからLCD用基板を一枚ずつ取り 出した後、搬送機構がキャリアから処理室側まで移動し ロードロック室と対峙する。次いで、ロードロック室の 搬出入口のゲートバルブが開き、大気圧化で搬送アーム を介してLCD用基板をロードロック室内へ搬入し搬送 アームがロードロック室から退避した後、ゲートバルブ を閉じてロードロック室内を密閉する。その後、ロード ロック室内の空気を例えば窒素ガス等の不活性ガスで置 換すると共に、ロードロック室内の不活性ガスを排気 し、ロードロック室内を搬送室内と同程度の減圧状態に する。次いで、搬送室側のゲートバルブが開き、ロード ロック室と搬送室が連通した後、搬送室内の搬送アーム が駆動し、搬送アームを介してロードロック室内のLC D用基板を搬送室内へ搬入しゲートバルブを閉じる。搬 送室がロードロック室から遮断されると、処理室側のゲ ートバルブが開き、搬送アームを介して処理室内へLC D用基板を搬入した後、処理室から搬送アームが退避す ると共にゲートバルブが閉じ、処理室と搬送室を遮断 し、処理室内でエッチングや成膜等の処理を開始する。 処理室内でLCD用基板の処理が終了すると、搬送室内 の搬送アーム及び搬送機構を介して上述した場合とは逆 の経路を辿って処理室からキャリア内の元の場所へ処理 後のLCD用基板を戻す。尚、引き続きLCD用基板に 対して別の処理を施す場合には搬送室内の搬送アームを 介して次に処理すべき処理室へ処理後のLCD用基板を 搬入し、その処理を施した後、キャリア内の元の場所へ 処理後のLCD用基板を戻す。

【0004】ところで、スループットを高めるとの観点 に基づき、搬送室と処理室との間でLCD用基板を搬送 する搬送機構として上下二段のダブルアームタイプの搬 送機構が知られている。この搬送機構は、例えば上下い ずれかのアームが処理室内への搬入専用に使用され、他 方のアームが処理室からの搬出専用に使用されている。

このように搬入、搬出専用のアームを使用して搬入、搬 出を並行して行い、LCD用基板の搬送時間の短縮を図 っている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ダブル アームタイプの搬送機構を用いた搬送システムの場合に は、LCD用基板等の被処理体の搬送時間を短縮するこ とができるが、上下二段のアームと各アームを個別に駆 動する駆動機構が必要であるため、搬送室のスペースが 大きくなると共に搬送機構の駆動機構が複雑になってコ 3

ることが難しく、信頼性に劣るという課題があった。また、駆動機構が多くなればそれだけパーティクルも発生し易いという課題があった。

【0006】本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、シングルアームでダブルアームに匹敵する搬送時間を確保することができ、しかも省スペース化及び低コスト化を実現することができ、信頼性の高い搬送システム及び処理装置を提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に記載の搬送システムは、減圧下で被処理体に所定の処理を施す処理室内の載置台に付設された上記被処理体の受け渡し機構と、この受け渡し機構まで上記被処理体を搬送して上記被処理体を遭取りし且つ上記処理室に対して連通、遮断可能に連結された搬送室内に配設された搬送機構とを備えた搬送システムにおいて、上記受け渡し機構は、上記載置台の上方で処理前後の被処理体を受け渡す昇降可能な複数の第1受け渡し部材と、第1受け渡し部材よりも高い位置で処理前後の被処理体を受け渡す昇降可能な複数の第2受け渡し部材とを有し、また、上記搬送機構は、少なくとも第1、第2受け渡し部材それぞれの受け渡し位置間で昇降するシングルアームを有することを特徴とするものである。

【0008】また、本発明の請求項2に記載の搬送システムは、請求項1に記載の発明において、第2受け渡し部材は上記載置台の上記被処理体の載置位置よりも外側に配置され且つ上記被処理体の外側から内側へ張り出す正逆回転可能な支持部材を有することを特徴とするものである。

【0009】また、本発明の請求項3に記載の処理装置は、減圧下で載置台上に載置された被処理体に所定の処理を施す処理室と、この処理室に対して連通、遮断可能に連結された搬送室と、この搬送室と上記処理室との間で処理前後の被処理体を遺取りする搬送システムとを備え、且つ、上記搬送システムは、上記載置台に付設された受け渡し機構と、上記搬送室内に配設された搬送機構とを備えた処理装置において、上記受け渡し機構は、上記載置台の上方で処理前後の被処理体を受け渡す昇降可能な複数の第1受け渡し部材と、第1受け渡し部材よりも高い位置で処理前後の被処理体を受け渡す昇降可能な複数の第2受け渡し部材とを有し、また、上記搬送機構は、少なくとも第1、第2受け渡し部材それぞれの受け渡し位置間で昇降するシングルアームを有することを特徴とするものである。

【0010】また、本発明の請求項4に記載の処理装置は、請求項3に記載の発明において、第2受け渡し部材は上記載置台の上記被処理体の載置位置よりも外側に配置され且つ上記被処理体の外側から内側へ張り出す正逆回転可能な支持部材を有することを特徴とするものであ 50

る。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、図1~図7に示す実施形態 に基づいて本発明を説明する。本実施形態の処理装置 は、例えば、図1に示すように、所定の減圧下でプラズ マを用いて被処理体(例えば、LCD用基板)1にCV D処理を施す3室の処理室2と、この処理室2がそれぞ れ周面に連通、遮断可能に連結された搬送室3と、この 搬送室3の周面に処理室2に隣接させて連通、遮断可能 10 に連結されバッファ室4と、このバッファ室4と処理室 2間で搬送室3に対向して配置されたキャリアCの載置 機構5とを備えている。搬送室3の周面には各処理室2 及びバッファ室4と連通する開口部4Aがそれぞれ形成 され、また、搬送室3のキャリアCと対向する周面にも 開口部4Aが形成されている。更に、各開口部4Aには ゲートバルブ6がそれぞれ取り付けられ、各ゲートバル ブ6を操作することによりそれぞれの開口部4Aを開閉 し、LCD用基板1を搬出入できるようにしてある。

【0012】而して、上記処理室2内には図2に示すよ うにLCD用基板1を載置する載置台7が配設され、こ の載置台7上でLCD用基板1に所定のCVD処理を施 すようにしてある。即ち、例えば処理室2の載置台7に は下部電極7Aが組み込まれ、この下部電極7Aの上方 にはこれと平行な上部電極 (図示せず) が配設されてい る。そして、下部電極7Aにはマッチング回路を介して 高周波電源(共に図示せず)が接続され、この高周波電 源から下部電極7Aに高周波電力を印加するようにして ある。また、上部電極はプロセスガスの供給部を兼ね、 下部電極7A上のLCD用基板1全面にシャワー状のプ ロセスガスを供給するようにしてある。従って、処理室 2内を所定の真空度に保持した状態で下部電極7Aに高 周波電力を印加し、プロセスガスをプラズマ化すること でLCD用基板1表面に絶縁膜、配線用膜等をCVD処 理により成膜するようにしてある。尚、7Bは下部電極 7Aを囲むシールドリングである。

【0013】上記処理室2に対するLCD用基板1の搬出入には図1~図4に示す搬送システム8が用いられる。この搬送システム8は、図2、図3に(a)、

(b)に示すように、上記載置台7に付設された受け渡し機構9と、上記搬送室3内に配設された搬送機構10とを備えて構成されている。この受け渡し機構9は、図2、図3の(a)、(b)に示すように、下部電極7Aの両側縁部の4箇所に昇降可能に配設され且つ載置台7の上方でLCD用基板1を受け渡す第1受け渡し部材9Aと、第1受け渡し部材9Aに対応してシールドリング7Bの7箇所に昇降可能に配設され且つ第1受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも高い位置でLCD用基板1を受け渡し部材9Aよりも同じてLCD用基板1の受け渡しを行う場合にはピンの

上端が下部電極7Aの側縁部に形成された孔7Cの内部 から受け渡し位置まで上昇し、その他の場合にはピンの 上端が孔7C内に収まるようにしてある。 第2受け渡し 部材9Bは、図3の(a)、(b)に示すように、例え ば90°だけ正逆回転するピン9Cと、このピン9Cの 上端に取り付けられた矩形状のプレート9Dとを備えて いる。そして、LCD用基板1の受け渡しを行う場合に は図3の(b)に示すようにプレート9Dがシールドリ ング7 Bの表面から受け渡し位置 (第1受け渡し部材9 Aの受け渡し位置より高い位置)まで上昇すると共にプ 10 レート9 Dの向きを一点鎖線で示す位置から実線で示す 位置まで90°変え、その他の場合にはプレート9Dが 一点鎖線で示す位置から下降してシールドリング7Bの 表面に接触するようにしてある。

【0014】また、上記搬送機構10は、図1、図4に 示すように、搬送室3の中央に配設された回転軸10A と、この回転軸10Aに連結された多関節型のシングル アーム10Bとを備えている。シングルアーム10B は、回転軸10Aの上端に基端部で連結された第1アー ム10Cと、第1アーム10Cの先端部に基端部で回転 20 可能に連結された第2アーム10Dと、第2アーム10 Dの先端部に基端部で回転可能に連結されたフォーク型 のハンド10日とを備えている。また、シングルアーム 10 Bは、図示しない昇降駆動機構 (例えば、エアシリ ンダ)により昇降する回転軸10Aを介して第1受け渡 し部材9Aの受け渡し位置と第2受け渡し部材9Bの受 け渡し位置との間で昇降するようになっている。

【0015】また、図1に示すように上記バッファ室4 は、複数のLCD用基板1を保持する昇降可能なバッフ ァ棚4Aと、バッファ棚4Aを囲む加熱領域4B及び冷 30 却領域4Cとを備え、搬送機構10を介してLCD用基 板1を搬出入する時、加熱領域4Bで処理前のLCD用 基板1を加熱して前処理する時、あるいは冷却領域4C で処理後のLCD用基板1を冷却する時にバッファ棚4 Aが昇降するようになっている。また、上記載置機構5 は図示しない昇降機構を備え、搬送機構10を介して搬 送室3とキャリアCとの間でLCD用基板1を遺取りす る時にキャリアCを昇降するようになっている。

【0016】次に、図5を参照しながら動作ついて説明 する。まず、キャリアCからLCD用基板1を取り出す 40 時には、所定の真空度に達した各処理室2のゲートバル ブ6を閉じた状態で他のゲートバルブ6を開き、搬送機 構10が駆動し、搬送機構10を介してキャリアC内の LCD用基板1を一枚ずつ取り出し、バッファ室4内へ 搬入する。バッファ室4内に所定枚数のLCD用基板1 を搬入すると、キャリアCに対応するゲートバルブ6を 閉じ、搬送室3及びバッファ室4内を真空引きし、各室 内を処理室2に相当する減圧状態にした後、バッファ室 4のゲートバルブ6を閉じる。

Aが昇降し、加熱領域4BでLCD用基板1を加熱し、 LCD用基板1表面に付着した水分等の不純物を飛ばす 前処理を行う。その後、所定の処理室2及びバッファ室 4のゲートバルブ6がそれぞれ開き、搬送機構10が駆 動し、LCD用基板1をバッファ室4から処理室2へ搬 送する。

【0018】この際、バッファ室4内でバッファ棚4A が昇降し、最初に取り出すべきLCD用基板1の高さを 搬送機構10のシングルアーム10Bの高さに合わせ る。この状態で、シングルアーム10日が伸び、ハンド 10日をバッファ棚4A内に挿入し、ハンド10日でし CD用基板1を保持した後、シングルアーム10Bが屈 曲してバッファ室4から搬送室3内にLCD用基板1を 搬出する。引き続き、回転軸10Aを介してシングルア ーム10Bが所定の処理室2の開口部4Aまで回転した 後、シングルアーム10BがLCD用基板1の引き渡し 位置まで昇降すると共に処理室2内まで伸びてLCD用 基板1を搬入する。この時既に、処理室2内の受け渡し 機構9の第1、第2受け渡し部材9A、9Bが受け渡し 位置まで上昇しているため、シングルアーム10Bが若 干下降し、ハンド10日から第2受け渡し部材9日上へ LCD用基板1を引き渡す。次いで、ハンド10Eが処 理室2内から退出すると共に第2受け渡し部材9 Bが下 降し、第2受け渡し部材9Bから第1受け渡し部材9A へLCD用基板1を引き渡した後、第1受け渡し部材9 Aが下部電極7A内に退没し、LCD用基板1を載置台 7A上へ引き渡す。LCD用基板1が載置台7A上に載 置され、シングルアーム10日が処理室2から退出する と、ゲートバルブ6で開口部4Aを閉じ、処理室2内で LCD用基板1に対するCVD処理が開始する。

【0019】搬送機構10はシングルアーム9Bが処理 室2から搬送室3内へ退出した後、シングルアーム10 Bを介して処理前のLCD用基板1をバッファ室4から 搬出し、既にLCD用基板1の処理を終了した処理室2 の開口部4AまでLCD用基板1を搬送する。この動作 と並行して処理室2のゲートバルブ6が開く。引き続 き、シングルアーム9Bが図5の(a)に示すようにL CD用基板 1 を処理室 2 内へ搬入し、ハンド 1 0 E が処 理室2内で駆動した受け渡し機構9の第2受け渡し部材 9 Bへの受け渡し位置まで進入した後、この位置からシ ングルアーム9 Bが若干下降し、同図の(b)に示すよ うにLCD用基板1を第2受け渡し部材9Bへ引き渡し た後、同図の(c)に示すようにシングルアーム9が屈 曲してハンド10日が載置台7から後退する。

【0020】引き続き、処理室2内で受け渡し機構9が 駆動し、第1受け渡し部材9Aが上昇して処理後のLC D用基板1を下部電極7Aから第2受け渡し部材9Bの 受け渡し位置よりも低い受け渡し位置まで持ち上げる。 この動作と並行して搬送機構10が駆動してシングルア 【0017】この状態でバッファ室4内のバッファ棚4 50 ーム10Bが伸び、図5の(d)に示すようにハンド1

0 Eが処理後のLCD用基板1の真下まで進出した後、シングルアーム9 Bが上昇して処理後のLCD用基板1をハンド10 Eで持ち上げた後、シングルアーム9 Bが居曲し、同図の(e)に示すようにハンド10 Eが処理室2から搬送室3内へ退出し、処理後のLCD用基板1を搬送室3内へ搬送する。一方、処理室2内では受け渡し機構9が連続して駆動し、第2受け渡し部材9 Bで保持した処理前のLCD用基板1を第1受け渡し部材9 Bで保持した処理前のLCD用基板1を第1受け渡し部材9 Bがピン9 Cを90。回転させながら下降し、下降端に達するとプレート9 Dが下部電極7 A と干渉しないシールドリング7 Bへ収まる。一方、第1受け渡し部材9 A も第2受け渡し部材9 B と並行して下降し、同図の(g)に示すように下部電極7 A 内へ退没すると共にLCD用基板1を下部電極7 A 上に載置する。

【0021】引き続き、上述したように処理室2内では LCD用基板1のCVD処理を行い、搬送機構10は処理後のLCD用基板1を搬送3からバッファ室4のバッファ棚4Aの元の場所まで搬送する。この時、バッファ室4の冷却領域4Cで処理後のLCD用基板1を冷却し、何時でもバッファ室4からキャリアCへ移載できる状態にしておく。バッファ室4内の全てのLCD用基板1の処理が終了すれば、搬入時とは逆の経路を辿ってバッファ室4からキャリアCへ処理後のLCD用基板1を一枚ずつ移載する。

【0022】以上説明したように本実施形態によれば、 処理室2内で処理前後のLCD用基板1を入れ替える際 に用いられる搬送システム8として、載置台7への受け 渡し位置を異にする第1、第2受け渡し部材9A、9B を有する受け渡し機構9と、第1受け渡し部材9Aの受 30 け渡し位置と第2受け渡し部材9Bの受け渡し位置との 間で昇降するシングルアーム10Bを有する搬送機構1 Oを設けたため、シングルアーム10Bで第2受け渡し 部材9Bへ処理前のLCD用基板1を引き渡し、ハンド 10mをそのLCD用基板1と干渉しない位置まで退避 させた後、引き続き第1受け渡し部材9Aによって載置 台7から持ち上げられた処理後のLCD用基板1を搬出 することができ、シングルアーム10Bによる処理前後 のLCD用基板1の搬入搬出動作を最小限に抑制し、処 理前後のLCD用基板1の交換時間を短縮し、ダブルア 40 ームに匹敵する短い時間で処理前後のLCD用基板 1を 交換することができる。しかも、受け渡し機構9は載置 台7内に組み込まれ、搬送機構10としてはシングルア ーム10Bで済ますことができるため、構造的にコンパ クトで省スペース化を実現することができると共にコス トの低減を実現することができる。

【0023】また、図6に示す工程で処理前後のLCD 用基板1を入れ替えても良い。上述の場合には処理前後 のLCD用基板1を入れ替える際に、まず、処理前のL CD用基板1を処理室1内へ搬入し、このLCD用基板

1を受け渡し機構9の第2受け渡し部材9Bで保持した 状態で第1受け渡し機構10Aを介して処理後のLCD 用基板1を搬出するようにしているが、図6に示す工程 では、まず処理後のLCD用基板1を第2受け渡し部材 9 Bで保持した状態で処理前のLCD用基板1を搬入す るようにしている。即ち、図6の(a)に示すようにL CD用基板1の処理が終了すると、同図の(b)に示す ように受け渡し機構9の第1受け渡し部材9Aが上昇し て処理後のLCD用基板1を持ち上げ、引き続き、同図 の(c)に示すように第2受け渡し部材9Bが上昇して 10 第1受け渡し部材9Aから処理後のしCD用基板1を引 き取る。その後、搬送機構10が駆動してハンド10E が処理室2内へ進出して処理前のLCD用基板1を搬入 し、同図の(d)に示すように第2受け渡し部材9日で 保持された処理後のLCD用基板1の下方で下部電極7 Aから突出した第1受け渡し部材9Aに処理前のLCD 用基板1を引き渡す。次いで、同図の(e)に示すよう にハンド10Eが載置台7から後退すると共に第1受け 渡し部材9Aが下降して処理前のLCD用基板1を載置 20 台7上へ引き渡す。更に、同図の(f)に示すようにハ ンド10日が進出し、第2受け渡し部材9日から処理後 のLCD用基板1を受け取り、同図の(g)に示すよう にハンド10Eで処理後のLCD用基板1を処理室2内 から搬出する。

【0024】図6に示す方法で処理前後のLCD用基板 1を入れ替えても図5に示す場合と同様に作用効果を期 することができる。但し、図6に示す場合には、処理前 のLCD用基板1が処理後のLCD用基板1の下方に搬 入するため、パーティクルによる汚染の虞があるため、 図5に示す工程で処理前後のLCD用基板1を入れ替え る方が好ましい。

【0025】尚、本実施形態では、処理装置としてLC D用基板1のプラズマ処理による成膜装置を例に挙げて本発明を説明したが、本発明はエッチング装置等の他の処理について適用することができ、また、半導体ウエハの各種の処理装置についても本発明を適用することができる。

[0026]

【発明の効果】本発明の請求項1~請求項4に記載の発明によれば、シングルアームでダブルアームに匹敵する搬送時間を確保することができ、しかも省スペース化及び低コスト化を実現することができ、信頼性の高い搬送システム及び処理装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の処理装置の一実施形態を示す斜視図である。

【図2】図1に示す処理装置の搬送機構を示す斜視図である。

のLCD用基板1を入れ替える際に、まず、処理前のL 【図3】図2に示す搬送機構により処理室内の載置台に CD用基板1を処理室1内へ搬入し、このLCD用基板 50 処理前後のLCD用基板を受け渡す状態の要部を示す斜 視図である。

【図4】図3に示す第1、第2受け渡し機構を示す図 で、(a)は動作前の状態を示す平面図、(b)は動作 中の状態を示す斜視図である。

【図5】(a) \sim (g)はそれぞれ搬送アームと受け渡 し機構間における受け渡し工程の一例を示す斜視図であ る。

【図6】(a)~(g)はそれぞれ搬送アームと受け渡 し機構間における受け渡し工程の他の例を示す斜視図で ある。

【符号の説明】

処理室2

LCD用基板(被処理体) 1

10

2 処理室

3 搬送室

7 載置台

搬送システム 8

受け渡し機構 9

9A 第1受け渡し部材

9B 第2受け渡し部材

9D プレート(支持部材)

10 10 搬送機構

10B シングルアーム

【図1】

10 数送模构

44

3 级战室

IOE(10)

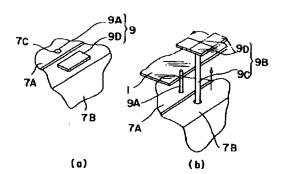
【図2】

5 萬屆凝群

9D 9C 弟i受け汉に部村 9A 9B 弟2受け渡し部材

9 受け返し機構

【図3】



【図4】

